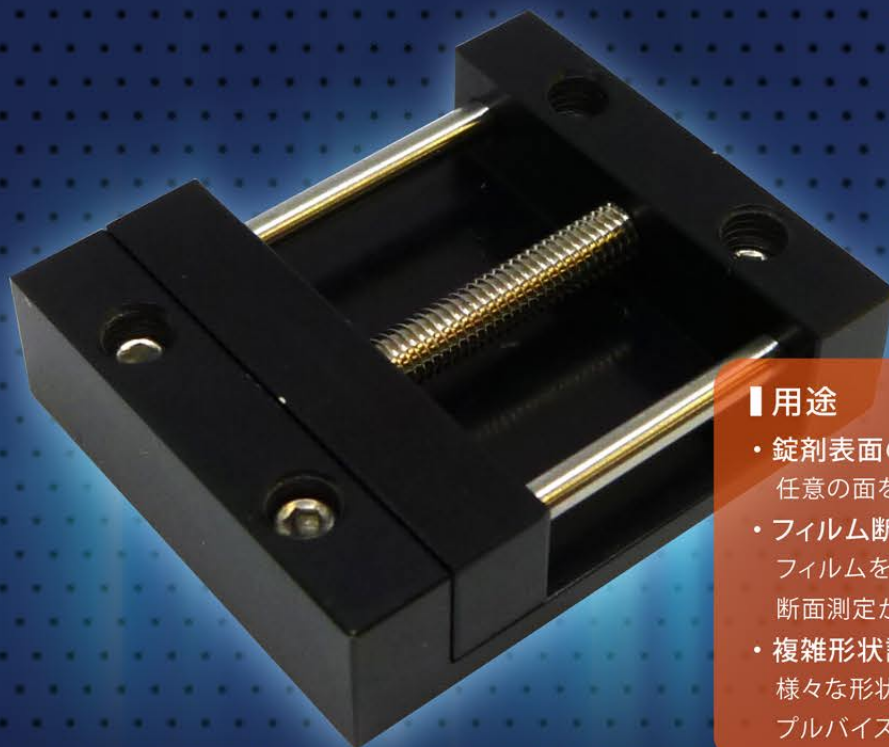


光軸に測定面を調整するための必須アイテム

顕微反射・ATR用

小型サンプルバイス

Micro Sampling Vise for Micro-IR/Raman



用途

- ・錠剤表面の異物
任意の面を光軸へ合わせることができます
- ・フィルム断面
フィルムを挟んで保持することによって断面測定ができます
- ・複雑形状試料の表面
様々な形状のサンプルに合わせてサンプルバイスを選択できます

特長
1

簡単に顕微 IR/Raman のステージへ設置

特長
2

傾斜ネジによって 7°程度まで傾けることが可能

特長
3

二種類のサンプルバイスは幅広いサイズに対応

使用例

錠剤表面の異物



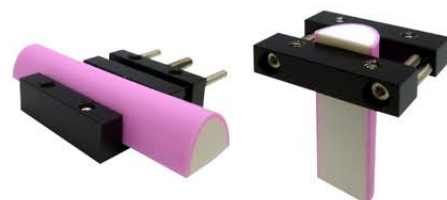
錠剤の傾斜面に異物がある場合、異物面が最上部になるように試料を設置する必要があります。通常では難しい設置技術ですが、サンプルバイスを使用すると、錠剤の固定と異物面の位置調整が非常に簡単です。

積層フィルム断面



積層フィルムの断面を顕微 IR の光軸に対して垂直に設置することは困難です。サンプルバイスへ積層フィルムを挟むだけで断面の測定が簡単にできます。フィルムをバイスに固定したのち、ナイフで簡単に断面出しができます。

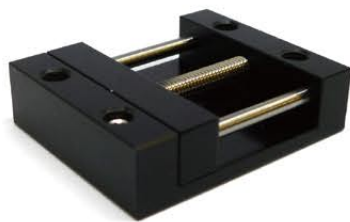
長辺試料



側面の測定には「万力型サンプルバイス」、端面の測定には「中空型サンプルバイス」が適しています。試料形状や測定目的面に適したサンプルバイスを使い分けます。

■ サンプルバイス万力型 (S)

品番：IRP-VSH-001



本体サイズ	閉口時：30(W) x 25(D) x 8(H)
	開口時：30(W) x 25(D) x 8(H)
サンプルサイズ	最大 13.5 mm(W) x 任意 (D) x <10 mm(H)

広い奥行制限：長辺サンプルの側面などの測定に最適
傾斜ネジ：任意の方向へ7°までの傾斜が可能

■ サンプルバイス中空型 (S)

品番：IRP-VSH-003

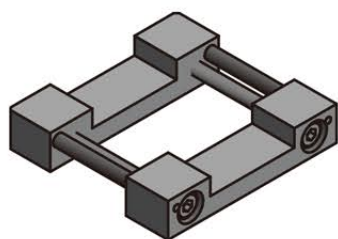


本体サイズ	閉口時：15(W) x 30(D) x 6(H)
	開口時：28.5(W) x 30(D) x 6(H)
サンプルサイズ	最大 13.5 mm(W) x 20 mm(D) x <30 mm(H)

広い高さ制限：長辺サンプルの先端などの測定に最適
傾斜ネジ：任意の方向へ7°までの傾斜が可能

■ サンプルバイス中空凹型 (S)

品番：IRP-VSH-005



本体サイズ	閉口時：15(W) x 30(D) x 6(H)
	開口時：28.5(W) x 30(D) x 6(H)
サンプルサイズ	最大 13.5 mm(W) x 20 mm(D) x <30 mm(H)

凹面加工：凹面を上にして使用すると、焦点とステージ間の作業スペース (WD) が小さいシステムにも対応
傾斜ネジ：なし

■ マイクロバイスをサポートする便利な製品

クイックトリミングツール

品番：TT-111



試料の切断、断面出しに最適な前処理ツールです。

低高傾斜ステージ

品番：IRP-MSA-001

NO IMAGE

サンプルバイスの設置が可能。直感的な操作で簡単に傾斜させることができる便利ツールです。

低粘着ゲルシート

品番：IRP-CSB-001



サンプルバイスやサンプルなどを各種ステージへ簡単に仮固定するための便利ツールです。再利用可。